

تأثیر دما و زمان حرارت دهی بر خواص اپتیکی نانولایه های اکسیدروی LiNbO_3 انباشت شده بر کریستال

اکبر زنده نام، مرضیه شیرازی و سمیرا دولتشاه

آزمایشگاه فنون نانو و لایه نشانی، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک

(دریافت مقاله: ۸۹/۱/۱۴ - پذیرش مقاله: ۸۹/۱۲/۲۱)

چکیده

در این پژوهش لایه های نازک اکسید روی (ZnO) از طریق اکسیداسیون حرارتی لایه های نازک روی (Zn)، که به روش کندو پاش مگنترون بر زیر لایه نیوبات لیتیم انباشت شده، تولید گردیدند. وابستگی به دما و مدت زمان گرمادهی ویژگی های اپتیکی این نانولایه ها مورد مطالعه قرار گرفته است. تغییرات توان عبوردهی (T)، بازتابندگی (R) و ضریب خاموشی (k) نمونه ها برای گستره طول موج ۲۰۰-۱۱۰۰ نانومترنیست به دما و زمان حرارت دهی اندازه گیری شده است. با افزایش دمای بازپخت توان عبوردهی لایه ها کاهش نشان می دهد و در دمای زیاد (800°C) که احتمال نفوذ لایه ZnO به زیرلایه نیوبات لیتیم فزونی می یابد، عبوردهی افزایش یافته و به توان عبوردهی اولیه زیرلایه نزدیک می گردد. انرژی گاف اپتیکی لایه های اکسیدروی برای شرایط متفاوت حرارت دهی اندازه گیری شده و با افزایش دما مقدار آن کاهش می یابد، در دمای 800°C با ازدیاد زمان حرارت دهی انرژی گاف اپتیکی فرونی یافته و در این شرایط نفوذ لایه به درون نیوبات لیتیم فراهم می گردد.

واژه های کلیدی: لایه نازک اکسیدروی، بلور نیوبات لیتیم، خواص اپتیکی، کنار پاش مگنترون.

The effect of temperature and heating period on optical properties of ZnO nano layers deposited on LiNbO_3

A. Zendehnam, M. Shirazi and S. Doulatshah

Thin Film Laboratory, Physics Department, Faculty of Science, Arak University, Arak, Iran

Abstract

In this work, the optical properties of ZnO thin films were investigated experimentally. Zinc was sputtered by the magnetron sputtering method on the LiNbO_3 crystal (as substrate), followed by a thermal oxidation at 450°C of the obtained ZnO films. The variations of the transmittance, reflectance, and extinction coefficient were measured for temperatures ($450\text{-}800^{\circ}\text{C}$) and different periods of heating (15-120min) which were employed to study their effects on the optical characteristics of the ZnO samples. The optical band gap energy was determined and it showed reduction with temperature and an increase at 800°C with period of heating.

Keywords: ZnO Thin Films, LiNbO_3 , Optical Properties, Magnetron Sputtering.

E-mail of corresponding author: A-zendehnam@araku.ac.ir

مقدمه

Mogjir-hai-nori-az-mehmertin-e-jaze-e-sistem-hai-erbiati-and-mehmertin-e-sistem-hai-erbiati-est-ke-az-anha-bray-enqal-sigkan-nori-w-be-ranz-dar-awordan-e-telolasat-e-safadeh-e-shod-amroze-safadeh-e-zogheh-mogjir-hai-niobat-litim-be-dilil-kahash-astr-pakandegi-dr-fibir-nori-w-fraham-krdn-pehnay-band-mord-niaz-mord-tوجه-fravon-car-گرفteh-est-[۲و۱]. dr-erbiat-e-mehmertin-e-niobat-litim-ke-be-wltaaz-kmni-niaz-dashth-e-watalaf-kmni-darnd-az-ahmiy-e-besraviy-br-hor-dar-est-dr-ain-mian-mogjir-niobat-litim-ulavo-br-dashn-ain-dw-wizgk-srurt-pasx-گowiy-balayi-niz-dard.

Blor-niobat-litim-daray-saxtarai-nahehsangard-shafaf-w-na-mehloul-dr-ab-est-dmey-dzob-ain-blor-1240°C-w-dmey-kouri-an-1210°C-est.[۳].

Krystal-niobat-litim-iky-az-mehmertin-blor-hai-gir-xetvi-doshkostti-est-ke-daray-xwach-froalktrik-pizualktrik-astr-poklaz-bodeh-w-dr-towl-mow-hai-froosrx-(IR)-shafavit-nori-mansiby-dard-ain-blor-karbrd-hai-mtnouy-dr-sistem-hai-enqal-sigkan-mehmertin-e-sistem-hai-erbiati-rah-dor-saxt-madolator-hai-nori-w-abzah-hai-akostowatipki-dard-[۳]. mehmertin-karbrd-ain-blor-saxt-mogjir-hai-nori-km-atalaf-ba-safadeh-az-nfoudh-hai-unscr-mansib-(Zn,Ti)-drzir-laye-niobat-litim-est.[۴].

Oulin-mogjir-niobat-litim-ke-be-kmk-nfoud-unscr-titanim-saxtne-shd-qabilat-hdait-hr-do-md-qetbesh(TM,TE)-ra-dashth-w-dr-گstere-madon-qrmz-tyif-kariayi-hwobi-dashth-ama-be-dilil-hsasit-nurshkostti-bal-ke-menjer-be-pakandegi-nor-mi-shd-dr-nahiyeh-mrni-tyif-kariayi-an-chnadan-mansib-nbod-.[۴].

Az-sowayi-diig-tyif-nfoud-titanim-dr-niobat-litim-paiyin-bodeh-nfoud-titanim-dr-dmehay-bal-(T>1000°C)-w-zmehay-teleani(8-6-sasut)-sorut-mi-geerd-be-dilil-nzdiyki-ain-bazh-dmeyi-be-dmey-bhrani-blor-niobat-litim-faz-Li2O-az-an-خارج-shde-w-bauch-txrib-pdilidh-nurshkostti-dr-blor

می شود، در نتیجه موجبر ساخته شده تنها قادر به هدایت MD TM خواهد بود [۲و۵].

بهترین جایگزین در ساخت نیوبات لیتیم فلز روی (Zn) می باشد. عنصر روی فلزی ارزان، غیر سمی و با پایداری گرمایی و شیمیایی زیاد می باشد. عبوردهی خوب در ناحیه مرئی و IR، جذب کامل نور در ناحیه فرابنفش (کمتر az ۳۷۰nm)، خواص پیزوالکتریک، رسانندگی مناسب و امکان انباشت به روش های متنوع شیمیایی و فیزیکی از مهمترین مزیت های فلز روی می باشد [۶].

عنصر روی دارای انرژی فعالسازی پایین و در نتیجه ضریب نفوذ بالا در نیوبات لیتیم است [۶]. حفظ خاصیت بلوری نیوبات لیتیم پس از نفوذ دهی، ثابت ماندن ضرایب الکتروپاتیک بلور و جابه جایی لبه جذب نسبت به بلور نیوبات لیتیم اولیه به سمت ناحیه فرابنفش با طول موج های کوتاهتر، فلزروی را به عنصری مناسب برای ساخت موجبر نیوبات لیتیم تبدیل کرده است [۷و۸].

شایان ذکر است که نفوذ دهی روی، در دماهای نسبتا پایین ($T < 900^{\circ}\text{C}$) و در مدت زمان کمتر (۲-۳ ساعت) انجام می پذیرد، لذا احتمال خروج فاز Li_2O از بلور و اختلال در حوزه های فروالکتریک به ندرت اتفاق می افتد [۶و۷]. از طرفی فرآیند نفوذ روی در نیوبات لیتیم بر خلاف تیتانیم به محیط بی اثر و خلا نیازنداresd [۹].

نفوذ ZnO در نیوبات لیتیم به روش های متنوعی همچون گرمایش زیر لایه در محیط بخار Zn و سپس بازیخت لایه انباشتی در هوای آزاد در دمای $900-800^{\circ}\text{C}$ و یا نفوذ Zn در بلور نیوبات لیتیم با استفاده از هدف ZnO به روش کندوپاش رادیوفرکانس(RF)، انجام پذیرفته است [۱۰]. اما استفاده از روش کندوپاش مگترون DC به ندرت گزارش شده است. بالایون انسری ذرات در روش کندوپاش مگترون، خلوص زیاد لایه، چگالی پکیدگی زیاد و چسبندگی خوب لایه به زیر لایه، یکنواختی ضخامت، رشدبرآراستی لایه ها در دماهای پایین انباشت و امکان انباشت بر روی زیر لایه هایی با ابعاد

(از نظر فشار گاز آرگون و جریان و ولتاژ) برای انباشت حاصل گردید. (جدول (۱)) در این شرایط آهنگ مناسب لایه نشانی، یکنواختی و پیوستگی لایه انباشت شده مد نظر بوده است (یافتن شرایط بهینه برای انباشت ابتدا روی زیر لایه های شیشه ای انجام پذیرفت [۱۲]).

لایه های Zn انباشت شده روی کریستال نیوبات لیتیم در محیط هوا در دمای 450°C به مدت ۱۵ دقیقه به منظور اکسیداسیون روی (Zn) حرارت دهی شدند (رطوبت متوسط آزمایشگاه در حین اکسیداسیون 60°C درصد بوده است). سپس لایه ها در دماهای متفاوت (500°C - 800°C) به مدت ۱۵ دقیقه برای هر دما پس بازپخت گردیدند. بعد از آن به منظور بررسی نفوذ Zn در بلور نیوبات لیتیم نمونه ها در دمای 800°C و در زمان های متفاوت (۱۵-۱۲۰ دقیقه) حرارت دهی شدند.

ضخامت لایه ZnO ۱۵۰ نانومتر بوده که به روش پس پراکنده‌گی راترفورد (RBS) اندازه گیری شده است [۱۳]. طیف عبوری (T) و جذبی (A) لایه ها با استفاده از دستگاه Camspec model M350 در گستره طول موج $1100-2000$ نانومتر اندازه گیری شدند، تأثیر دما و زمان پس بازپخت بر ویژگی ها و پارامترهای اپتیکی نمونه های تولید شده مورد بررسی قرار گیرند. تغییرات توان عبوردهی، بازتاب و نمار خاموشی به همراه انرژی گاف اپتیکی نمونه ها نسبت به دما و زمان حرارت دهی مطالعه شدند.

وابستگی دمایی و زمان حرارت دهی خواص اپتیکی لایه های نازک ZnO بر گستره بلور نیوبات لیتیم که به روش کندوپاش فلز روی و اکسیداسیون حرارتی تولید شده باشد، تا به حال انجام نشده است و این برای اولین بار است که اثر این گونه پارامترها مورد مطالعه قرار می گیرند.

جدول ۱. شرایط انباشت نانولایه اکسیدروی

آهنگ انباشت (mbar)	فشار پیش خلا (V)	جریان ولتاژ (A)	فشار آرگون (mbar)	nm/s
10^{-1}	0.4	620	10^{-5}	1.95

بزرگ از مهمترین مزایای روش کندوپاش مگترون DC است.

در این تحقیق، ویژگی های اپتیکی لایه نازک ZnO انباشت شده بر زیر لایه نیوبات لیتیم که به روش اکسیداسیون حرارتی لایه Zn تولید شده مورد مطالعه قرار گرفته است.

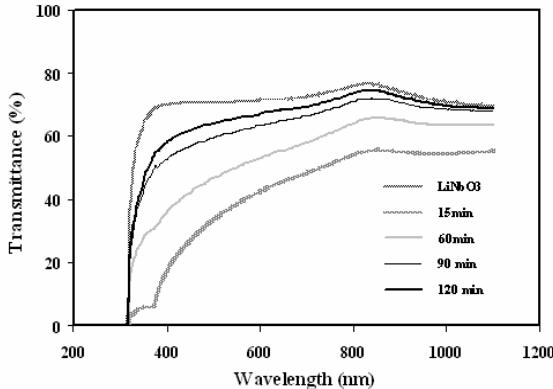
مواد و روش آزمایش ها

در این پژوهش از بلور نیوبات لیتیم (x-cut) با خلوص ۹۹/۹۹۸ درصد محصول شرکت Foctek به عنوان زیر لایه استفاده شد. ضخامت بلور 5 mm^2 میلیمتر و ابعاد $10\times 20\text{ mm}^2$ است. انباشت فلز روی توسط دستگاه لایه نشانی در خلا، کندوپاش مگترون با هدف تخت Hind High Vacuum (H.H.V) ۱۲" MSPT مدل انجام شده است. کاتد قرص دایره ای به شعاع $12/5\text{ mm}$ درصد می باشد. قبل از انباشت، ابتدا خلوص ۹۹/۹ درصد می باشد. قبلاً از انباشت، ابتدا زیر لایه ها با الکل ایزوپروپانول و به مدت ۲ دقیقه در حمام فرماحتی^۱ و سپس آب جوش و الکل تمیز شد. فشار پیش خلا دستگاه لایه نشانی 10^{-5} mbar و گستره فشار گاز آرگون برای ایجاد پلاسمای هنگام لایه نشانی $(0.2-1)\times 10^{-1}\text{ mbar}$ بکار گرفته شده است. لایه نشانی باشدت جریان 1 A ، ولتاژ $350-600\text{ V}$ و ولتاژ $2-1\text{ A}$ با نرخ انباشت متفاوت انجام شده است. دمای زیر لایه هنگام لایه نشانی از 300 K تا 600 K می تواند تغییر کند، که این دما با استفاده از ترموموکوپل دیجیتالی که در قسمت تحتانی زیر لایه تعییه شده، اندازه گیری می شود. که در این کار فلز روی در دمای 400 K انباشت گردید. ضخامت لایه انباشتی روی سطح زیر لایه باید به اندازه ای باشد که در مدت زمان حرارت دهی کل آن بتواند به درون ساختار بلوری نفوذ کند تا سطح زیر لایه از هر گونه تخریب یا نقصی مصون بماند. [۱۱]

پس از انجام آزمایش های متعدد، بهینه شرایط لایه نشانی

1.Ultrasonic bath

البته ورود Zn به درون بلور باعث می شود که عبوردهی نمونه ها در طول موج های کوتاه تر قدری کمتر باشد، که این امر به دلیل تغییر در ساختار بلور به علت نفوذ فلز روی در آن است.



شکل ۲. تغییرات توان عبوردهی نسبت به طول موج برای زمان های متفاوت (800°C)

با توجه به شکل ۳ با افزایش دمای پس بازپخت، توان بازتاب نمونه ها افزایش می یابد، چرا که با بیشتر شدن دما چگالی پکیدگی لایه فرونی یافته و احتمال کاهش اکسیژن های سطحی وجود دارد و توان بازتابندگی افزایش می یابد. اما در دمای 800°C و شروع نفوذ Zn به درون کریستال نیوبات لیتیم فاز جدید ZnNb_2O_6 شکل می گیرد و توان بازتاب کاهش می یابد. (شکل ۴)

در بررسی های ساختاری نمونه ها با استفاده از پراش اشعه X (XRD) پیک های مربوط به فاز ZnNb_2O_6 وقتی که دما به حدکافی برای نفوذ افزایش یافته ($T > 700^{\circ}\text{C}$) مشاهده گردیده است. [۱۵]

ضریب جذب لایه (α) از رابطه زیر بدست می آید [۱۶]:

$$\alpha = \frac{1}{t} \ln\left(\frac{T_0}{T}\right) \quad (1)$$

در این رابطه t ضخامت لایه، T_0 توان عبوردهی زیرلایه و T توان عبوردهی نمونه با وجود لایه نازک ZnO است. ضریب خاموشی لایه با طول موج (λ) و ضریب جذب لایه (α) بصورت زیر ارتباط دارد، (رابطه ۲) [۱۶] :

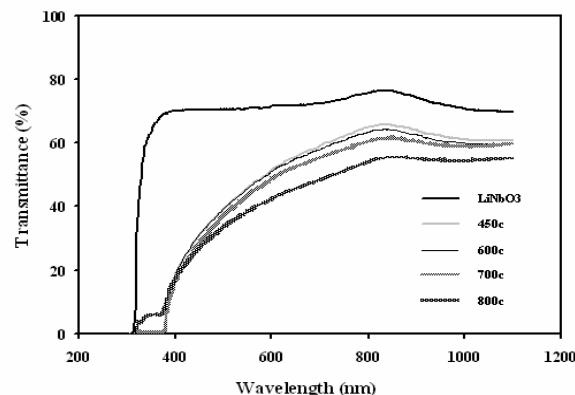
$$k = \frac{\lambda\alpha}{4\pi} \quad (2)$$

نتایج و بحث

در شکل ۱ عبور اپتیکی لایه های نازک ZnO و زیرلایه نیوبات لیتیم برای دماهای متفاوت در گستره طول موج $1100 - 200$ نانومتر نشان داده شده است.

همان طور که در شکل ۱ ملاحظه می شود توان عبوردهی نمونه با افزایش دما، کاهش می یابد، چراکه هنوز ZnO فرست نفوذ در کریستال نیوبات لیتیم را نیافته و احتمالاً توان بازتابندگی چگالی پکیدگی لایه زیاد می شود، و احتمالاً توان بازتابندگی نیز فرونی می یابد. برای دماهای بیشتر از 550°C که احتمال زدایش اکسیژن نیز بوقوع می پیوندد، این پدیده ها می توانند قدرت عبور نمونه ها را کاهش دهند. شروع عبوردهی در بلور نیوبات لیتیم خام از طول موج 312 نانومتر می باشد، در حالی که عبوردهی لایه نازک ZnO از طول موج 378 نانومتر که در نزدیکی انرژی گاف اپتیکی اکسیدروی (۳,۳ev) است، آغاز می گردد. نتایج حاصل از بررسی های اپتیکی ZnO با کارهای دیگران همخوانی دارد [۱۴].

با افزایش زمان حرارت دهی در دمای 800°C همان طور که در شکل ۲ دیده می شود، توان عبوردهی لایه فرونی یافته و در دمای 800°C نفوذ Zn در بلور نیوبات لیتیم نیز شروع می شود. با افزایش زمان حرارت دهی عمق نفوذ Zn بیشتر شده و توان عبوردهی به گذردهی اولیه نیوبات لیتیم خام نزدیک می شود و عبوردهی دوباره از طول موج 312 نانومتر آغاز می گردد.



شکل ۱. تغییرات توان عبوردهی نسبت به طول موج برای دماهای متفاوت

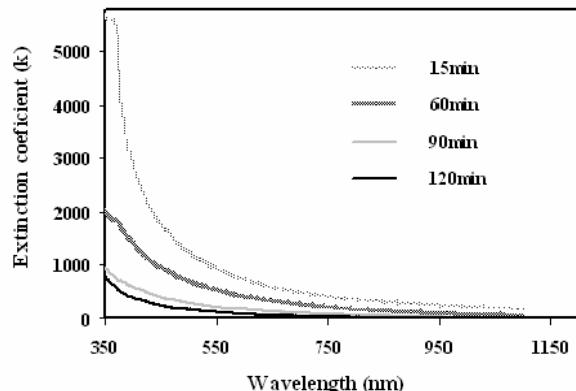
اما در دمای 800°C که نفوذ شروع می شود، ضریب خاموشی افزایش می یابد (مدت زمان حرارت دهی ۱۵ دقیقه). در شکل (۶) ضریب خاموشی نمونه برحسب طول موج در دمای 800°C برای زمان های مختلف حرارت دهی نشان داده شده است.

همان طور که در شکل ۶ ملاحظه می شود، با افزایش زمان حرارت دهی فرآیند نفوذ آغاز شده و با افزایش زمان عمق نفوذ Zn در بلور افزایش یافته، لذا کاهش ضریب خاموشی بیشتر می گردد.

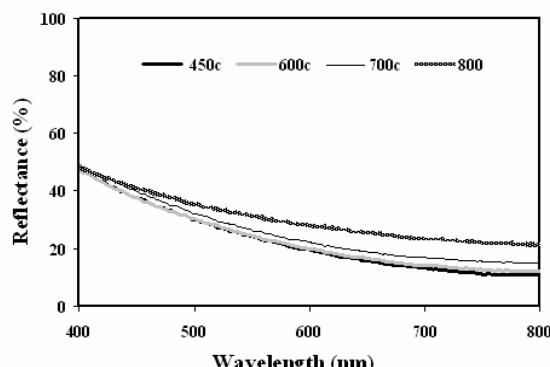
از رابطه ۳ می توان برای بدست آوردن انرژی گاف اپتیکی نیمه رساناها استفاده کرد [۱۶].

$$\alpha h\nu = B(h\nu - E_g)^n \quad (3)$$

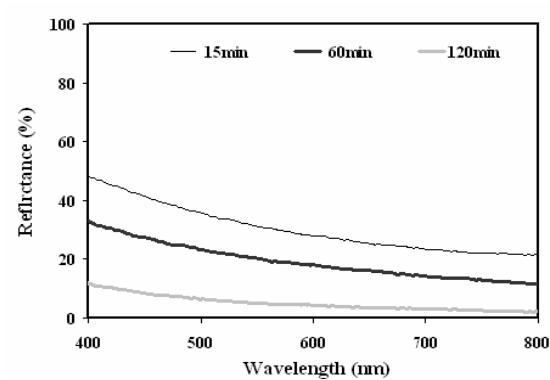
که $h\nu$ انرژی فوتون، α ضریب جذب لایه، B مقداری ثابت، E_g گاف انرژی می باشد. مقدار n برای نیمه رساناها با گاف مستقیم مجاز، مثل ZnO برابر $1/2$ است. بنابراین با رسم نمودار $(\alpha h\nu)^2$ بر حسب $h\nu$ و بروز یابی قسمت خطی نمودار می توان مقدار E_g را بدست آورد. در شکل های ۷ و ۸ نمودار $(\alpha h\nu)^2$ بر حسب $h\nu$ رسم شده و مقادیر E_g ، برای دمایها و زمان های مختلف پس بازپخت نشان داده شده است. تغییرات انرژی گاف اپتیکی لایه ها نسبت به دما و زمان حرارت دهی به ترتیب در جدول های ۲ و ۳ نیز ارائه گردیده است.



شکل ۶. تغییرات ضریب خاموشی نسبت به طول موج برای زمان های متفاوت (800°C)

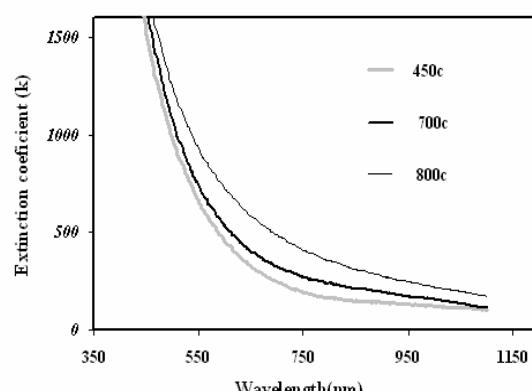


شکل ۳. تغییرات توان بازتاب نسبت به طول موج برای دمایهای متفاوت



شکل ۴. تغییرات توان بازتاب نسبت به طول موج برای زمان های متفاوت (800°C)

تغییرات ضریب خاموشی لایه (k) برحسب طول موج برای دمایهای مختلف حرارت دهی در شکل ۵ ارائه گردیده است. با توجه به شکل ۵ ضریب خاموشی در دمایهای کمتر از 800°C که نفوذ Zn در بلور احتمالاً آغاز نشده، تغییر چندانی نمی کند.



شکل ۵. تغییرات ضریب خاموشی نسبت به طول موج برای دمایهای متفاوت

این نوع بررسی های اپتیکی نانولایه اکسیدروی بر بستر نیوبات لیتیم بندرت انجام پذیرفته و اکثر مقالات بیشتر به ویژگی های ساختاری و فرآیند نفوذ پرداخته اند. [۴، ۷، ۸، ۱۸]. برخی از پژوهشگران نیز فقط به مطالعه ویژگی های فوتولومینسانس ZnO روی این کریستال اکتفا نموده اند [۱۴].

جدول ۲. انرژی گاف اپتیکی لایه ها نسبت به دما

temperature($^{\circ}\text{C}$)	۴۵۰	۶۰۰	۷۰۰	۸۰۰
Eg (ev)	۳.۲۵	۲.۲۵	۳.۲۵	۳.۱۹

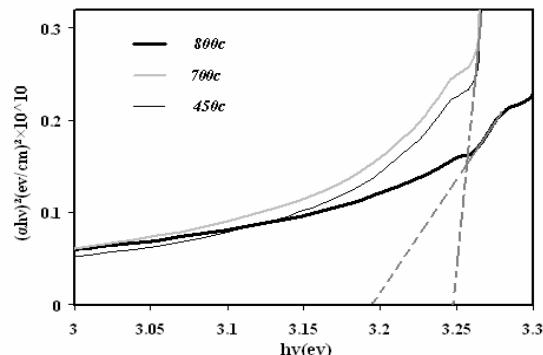
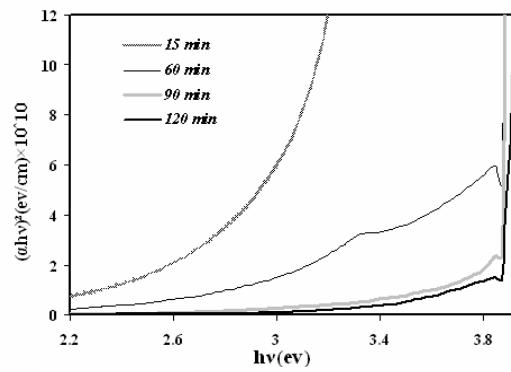
جدول ۳. انرژی گاف اپتیکی لایه ها نسبت به زمان حرارت دهی در دمای 800°C

Time (min)	۱۵	۶۰	۹۰	۱۲۰	LiNbO_3
Eg (ev)	۳.۱۹	۳.۸۷۰	۳.۸۷۵	۳.۸۷۵	۳.۰۹۵

نتیجه گیری

در اکثر بررسی ها روی ZnO روش های شیمیایی بکار گرفته شده است، اما در این کار برای انباشت نمونه ها از روش کندوپاش مگترون با مزایایی که بحث شد و روش اکسیداسیون حرارتی که راهکار بسیار ساده ای است، بهره گرفته شده است.

برای لایه اکسیدروی که از اکسیداسیون لایه نازک Zn بر زیر لایه نیوبات لیتیم ایجاد شده است، تامادامی که دمای پس بازپخت کم باشد، انرژی گاف نمونه ثابت می ماند که مقدار آن با مقادیر ذکر شده در منابع بسیار نزدیک است. (3.3 ev)، ولی وقتی دما و زمان حرارت دهی برای نفوذ روی به درون نیوبات لیتیم کافی باشد، گاف انرژی فزونی یافته و به مقدار گاف انرژی اپتیکی نیوبات لیتیم خام نزدیک می شود. با افزایش دمای پس بازپخت، توان عبوردهی نمونه کاهش می یابد، که می تواند به دلیل کاهش اکسیژن و تغییر چگالی پکیدگی در لایه باشد و توان بازتاب را بهبود می بخشد. اما وقتی دما به حد کافی برای نفوذ زیاد باشد، عبوردهی با زمان حرارت دهی افزایش می یابد و تقریباً به توان عبور اولیه

شکل ۷. تغییرات $(\alpha h\nu)^2$ نسبت به انرژی فوتون برای دماهای متفاوتشکل ۸. تغییرات $(\alpha h\nu)^2$ نسبت به انرژی فوتون برای زمان های متفاوت (800°C)

انرژی گاف نیوبات لیتیم خام با استفاده از این نمودارها $3/95$ الکترون ولت بدست آمده است (که در منابع نیز 4 الکترون ولت گزارش شده است، [۳]). در دمای 800°C مقدار انرژی ZnO $3/25$ الکترون ولت است که به انرژی گاف ZnO (3.3 ev) [۱۶ و ۱۷]، بسیار نزدیک است. مقدار E_g تا دمای 700°C تغییر محسوسی نمی کند، چرا که نفوذ Zn در بلور شروع نشده و هنوز روی سطح اکسیدروی وجود دارد. اما در دمای 800°C بدیل شروع فرآیند نفوذ مقدار E_g به $3/19$ الکترون ولت می رسد، (زمان حرارت دهی 15 دقیقه می باشد) با بیشتر شدن زمان حرارت دهی و افزایش عمق نفوذ Zn در بلور انرژی گاف نمونه ای که در دمای 800°C به مدت 120 دقیقه پس بازپخت شده است، به مقدار گاف انرژی خود بلور لیتیم نیوبات خام نزدیک می شود، ($3/875\text{ev}$)، که این اختلاف مختصر می تواند به دلیل نفوذ روی در درون کریستال و تغییر در ساختار بلور نیوبات لیتیم می باشد.

منابع

1. K. Okamoto, *Fundamentals of optical waveguides*, copyright @ 2000 by academic press. New York.
2. L. Wooten, K. M. Kiss, A. Yi, J. Murphy and D.A. Lafaw, *A review of lithium niobate modulators for fiber-optic communications systems*, IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 6(2000)69-82.
3. Y. Kuz'minov, *Lithium Niobate Crystals: Physico-chemical Aspects of Technology*, Cambridge International Science Publishing, 1999.
4. R. Nevada and G. Lifante, *Low-loss, damage-resistant optical waveguides in Zn-diffused LiNbO_3 by a two-step procedure*, Applied Physics A, 72(2001)725-728.
5. W. Gao and Z. Li, *ZnO thin films produced by magnetron sputtering*, International Ceramics, 30(2004)1155-1159.
6. B. Herreros and G. Lifante, *LiNbO_3 optical waveguides by Zn diffusion from vapor phase*, Applied Physics Letters, 66:12(1995)352-357.
7. R. Nevada, C. Seda, F. Segato, F. Caccavale, A. Kling ,J.C. Soares, E. Cantelar, F. Cysso and G. Lifante, *Compositional characterization of Zn-diffused lithium niobate waveguides*, Applied Physics B, 73(2001)555-558.
8. T. Volk, B. Maximov, T. Chernaya, N. Rubinia, M. Wohelecke and V. Simomov, *Photorefractive properties of $\text{LiNbO}_3\text{-Zn}$ crystals related to the defect structure*, Applied Physics B, 72(2001)647-652.
9. L. Arizmendi, *Photonic applications of lithium niobate crystals*, physica status solidi (a), 201(2)(2004)253-283.
10. T. Suhar, M. Fujimura, M. Uemvkai, *Waveguide nonlinear-optic wavelength conversion devices and their applications*, In photonics based on wavelength integration and manipulation, IPAP Books, 2(2005)137-150.
11. H. Yamamoto, N. Saiga and K. Nishimori, *ZnO thin films deposited on various LiNbO_3 substrates by RF-sputtering*, Applied Surface Science, 169(2001)517-520.
12. A. Zendehnam, M. Shirazi, S. Doulatshah and M. Sadat, *Effect of temperature and period of post-annealing on the optical properties of ZnO thin films*, Armenian Journal of Physics, 3(4)(2010)305-311.

بلور می رسد. مختصر اختلاف در توان عبوردهی، گاف انرژی و توان بازتاب نمونه ها با خود بلور نیوبیات لیتیم خام به علت نفوذ و وجود روی در این ماده است که تا اندازه ای ساختار درونی آن را دگرگون می نماید. این نتایج در موقع ساخت موجبرهای با کریستال نیوبیات لیتیم و وجود روی به عنوان ماده نفوذی از اهمیت زیادی برخوردار است.

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان مقاله از دانشگاه اراک و ستاد نانوتکنولوژی به جهت حمایت های مالی از این پژوهه کمال تشکر را دارند.

13. L. Aghli-Moghadam, A. Baghizadeh, G. Nabiyoun, A. Farashiani and A. Zendehnam, *Zn-diffused LiNbO_3 waveguides fabricated by DC magnetron sputtering*, Applied Physics A, 97(2009)805-810.
14. Y. Wang, H. Wang, S. Liu, H. Liu, S. Zhou, Y. Hang, J. Xu, J. Ye, Sh. Gu and R. Zhang, *MOCVD growth and properties of ZnO thin films on LiNbO_3 substrates*, Journal of Crystal Growth, 277(2005)378-381.
15. A. Zendehnam, M. Shirazi, M. Sadat and L. Aghli-Moghadam, *Annealing effect on structural and optical properties of ZnO thin films sputtered on LiNbO_3 substrate*, World Applied Sciences Journal 10(12),(2010)1473-1479.
16. N. Ekem, S. Korkmaz, S. Pat, M.Z. Balbog, E.N. Cetin and M. Ozmumcu, *Some physical properties of ZnO thin films prepared by RF sputtering technique*, International Journal of Hydrogen Energy, 34(2009)5218-5222.
17. J. S. Welling, N. B. Chaure, S. N. Heavens and I. M. Dharmadasa, *Characterization of electro deposited and sputtered Zinc oxide*, Journal of Thin Solid Film, 516(2008)3893-3898.
18. G. H. Lee, *Optical properties of ZnO thin films on LiNbO_3 and LiTaO_3 substrates grown by pulsed laser deposition*, Solid state communicate, 128(2003)351-354.